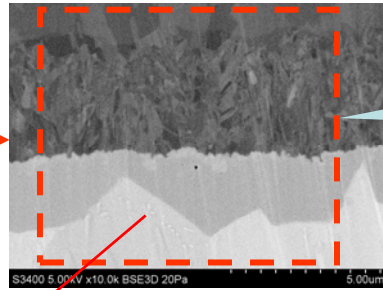
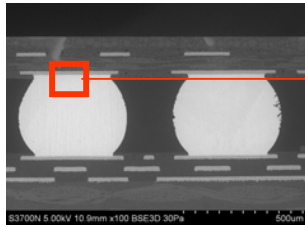


# CP試料調製⇒FIB-TEM-EDXの観察分析事例

CP加工断面のさらなるFIB加工-TEM観察を実施し、ナルベルの金属間合金層の観察-分析が可能になりました。

CP試料断面SEM観察

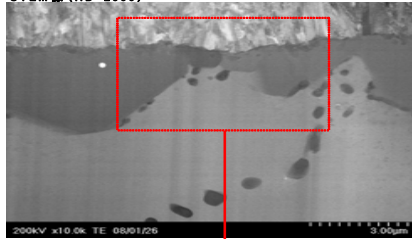


FIBによるマイクロサンプリング

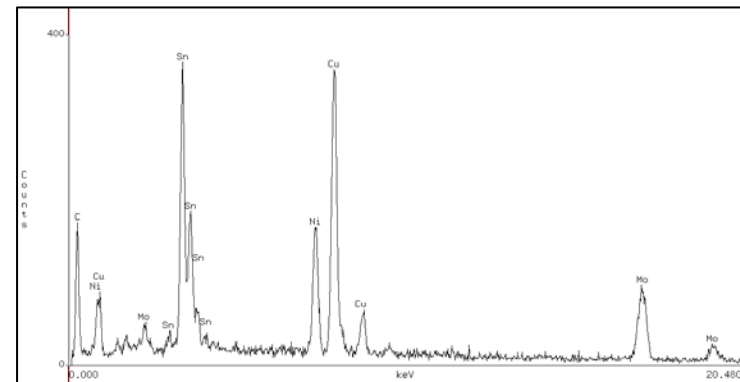
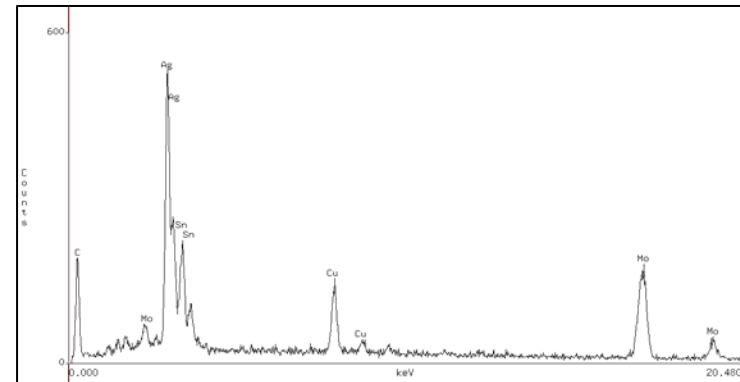
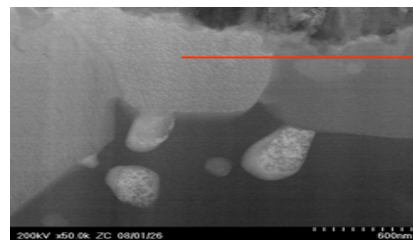
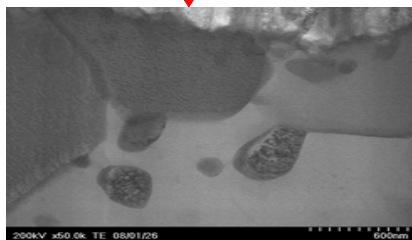
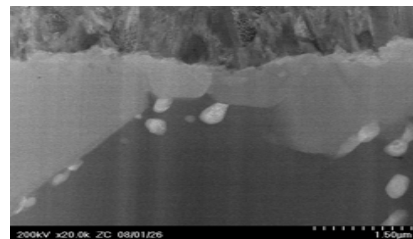
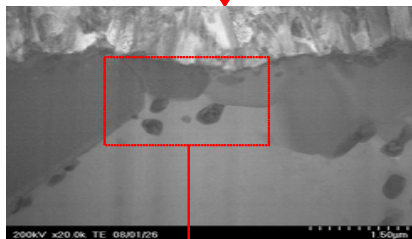
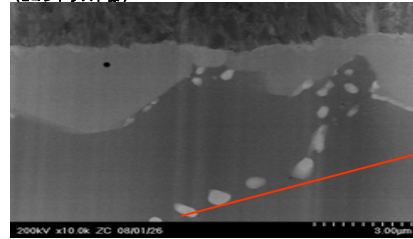
・20マイクロ未満の微小エリアを観察

CP試料断面TEM観察

STEM像 (HD-2000)



(Zコントラスト像)



ナルベルの金属間合金層の観察-分析ができました。